

エネルギー分散型蛍光X線分析装置

キーワード: 蛍光X線

メーカー: 株式会社リガク

測定項目: 元素分析、組成分析



主な仕様及び特長:

蛍光X線分析法は、X線を試料に照射したときに発生する蛍光X線のエネルギーや強度から、物質の成分元素や構成比率を分析する手法です。固体、液体、粉体を非破壊で分析することが可能です。X線の照射径が最小0.1 mmと微小部に対応でき、マッピングも可能です。また、大きな異形試料(300 mm×200 mm×高さ100 mm)に対応することができます。

設置場所: 第1研究棟4階

担当者: 電気電子工学科 岡本保

連絡先: 0438-30-4100, okamoto@e.kisarazu.ac.jp